

DUAL VIEW ICP-OES OHNE KOMPROMISSE

Agilent 5110 ICP-OES



DAS SCHNELLSTE UND PRÄZISESTE ICP-OES ALLER ZEITEN.

Das 5110 ICP-OES von Agilent mit synchronem vertikalem Dual View (SVDV) vereint Geschwindigkeit und Analyseleistung ohne Kompromisse.

Kompromisslose Geschwindigkeit

- Die schnellste Analytik in der ICP-OES und damit weniger Argonverbrauch.
- Reduzieren Sie die Kosten pro Analyse und steigern Sie Ihre Produktivität um mehr als das Doppelte mit dem Advanced Valve System (AVS).
- Messung aller Wellenlängen in einem Messvorgang ermöglicht höhere Präzision ohne Verzögerungen.
- Starten Sie Ihre Messungen schneller: der Vista Chip II-Detektor benötigt absolut kein Spülgas und bietet kürzere Aufwärmzeiten.

Kompromisslose Leistung

- Mit der stehenden (vertikalen) Fackel lassen sich auch die schwierigsten Proben ganz einfach messen.
- Der Halbleitergenerator gewährleistet eine ausgezeichnete Langzeitstabilität.

Kompromisslose Benutzerfreundlichkeit

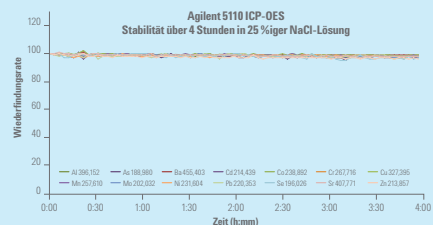
- Im IntelliQuant-Modus sehen Sie alle Elemente in Ihrer Probe auf einen Blick.
- Ersparen Sie sich das Rätselraten bei der Methodenentwicklung mithilfe der intuitiven ICP Expert-Software und der DSC-Technologie.
- Ein vollständig integriertes Schaltventil und das „Plug-and-Play“-Fackelsystem gewährleisten eine kurze Einarbeitung mit nur minimalem Anwendertraining.
- Maximieren Sie die Betriebsbereitschaft des Geräts mit intelligenter Diagnostik, welche die Fehlersuche einfach macht.

Flexible Konfigurationen

Das Agilent 5110 ist in drei Konfigurationen erhältlich:

- Synchrones Vertikales Dual View.
- Vertikales Dual View.
- Radial View.

Mit der stehenden (vertikalen) Fackel und dem robusten Halbleitergenerator in jeder Konfiguration ist das 5110 ICP-OES auch für die anspruchsvollsten Proben perfekt geeignet.



Gezeigt ist die Wiederfindungsrate einer Reihe von Elementen in 25 %iger NaCl-Lösung. Die Langzeitstabilität für alle Elemente lag über 4 Stunden bei < 1,3 % RSD - und das ohne Internen Standard!



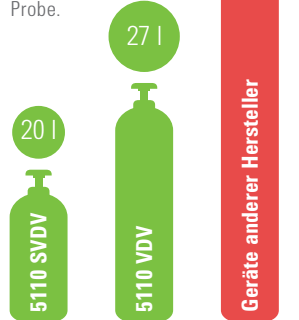
Agilent Technologies

Wie arbeitet ein Synchrones Vertikales Dual View?

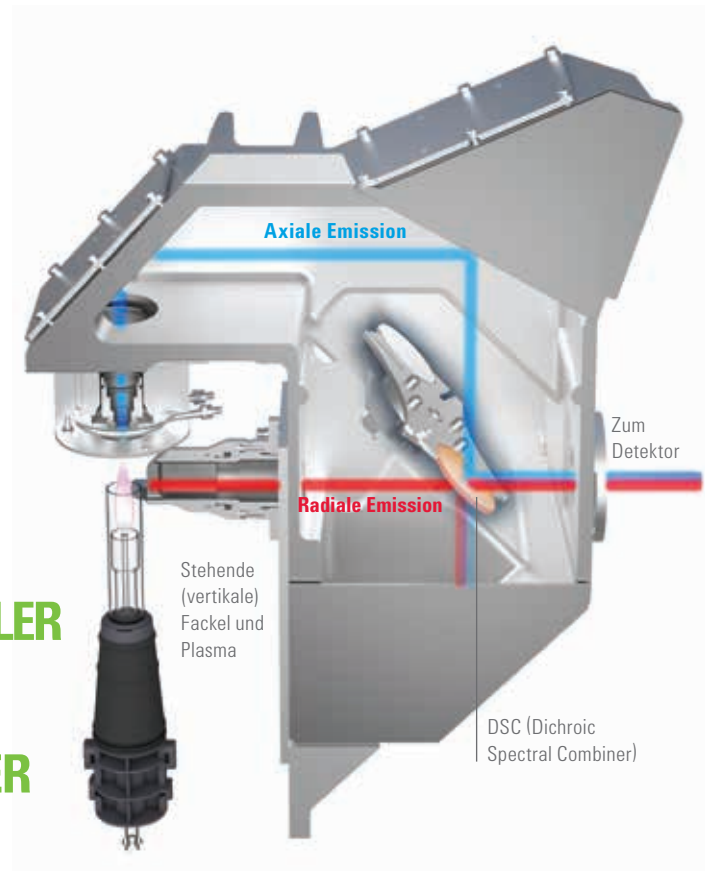
Mit dem 5110 SVDV ICP-OES müssen Sie nur eine Messung je Probe durchführen. Die einzigartige DSC-Technologie (Dichroic Spectral Combiner) ermöglicht es, sowohl die axiale als auch die radiale Emission in einer einzigen Messung zu erfassen. So erhalten Sie richtige und präzise Ergebnisse in kürzester Zeit¹.

Drastisch verringert Argonverbrauch¹

Das 5110 ICP-OES ist von allen ICP-OES-Instrumenten das mit dem niedrigsten Argonverbrauch je Probe.



55% SCHNELLER
50% WENIGER ARGON



Wussten Sie schon?

Bei konventionellen Dual View ICP-OES-Systemen müssen Sie eine Serie aufeinander folgender Messungen ausführen und vorher auswählen, welche Elemente im axialen und welche im radialen Modus gemessen werden sollen.

Manche Systeme sind außerdem für die Messung niedriger und hoher Wellenlängen in beiden Modi mit zwei Spalten ausgestattet. Für jede Probe sind daher bis zu vier aufeinander folgende Messungen erforderlich, was den Probendurchsatz entsprechend verringert.

¹ Analysegeschwindigkeit und Argonverbrauch werden mit den Angaben für Systeme der Wettbewerber anhand der Daten aus publizierten Applikationsschriften verglichen. Siehe Agilent Application Note 5991-4821EN

Weitere Informationen:
Wenden Sie sich an Ihren Agilent Servicepartner oder besuchen Sie:
www.agilent.com/chem/5110icpoes

Änderungen vorbehalten.

© Agilent Technologies, Inc. 2016
Veröffentlicht am 1. Mai 2016
5991-6855DEE



Agilent Technologies